磁光克尔显微镜

当一束线偏振光照被磁性介质反射后,反射光的偏振面相对于入射光的偏振面有一个小的角度偏转(克尔旋转角),这一现象被称为磁光克尔效应。该效应与显微成像技术结合组成磁光克尔显微镜,被广泛应用于磁性材料磁性测量,磁畴观察等。由于该设备可进行无损探测、灵敏度高、在极端环境下原位测量等优点是被越来越多的科研人员采用。



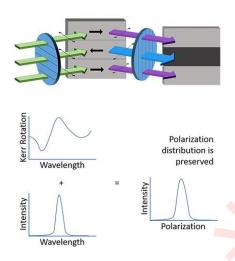
为满足日益增长的市场需求 具量光电推出了高性价比的磁光克尔显微镜。其主要原理是:一束面光源经过起偏器,转变为线偏振光,照射到样品上,由于样品内磁畴的存在使样品各个区域内磁化强度和方向不同,因此不同区域对线偏振光,偏振面的改变各不相同。因此当反射光通过检偏器后光斑的强度分布不同,从而得到样品的磁畴结构。

为了获得更高的灵敏度,优异的磁畴成像效果等该系统做了以下优化。

▲1) 采用高亮度窄带 LED 光源。

尽管理论上磁光克尔效应的对比度可以无限高,但是多个波长偏振像差的组合通常会大大降低偏振的纯度。因此传统的克尔显微镜经常报道磁光克尔对比度几乎观察不到。一个主要的原因就是因为使用宽谱的照明光源。因为磁光效应引

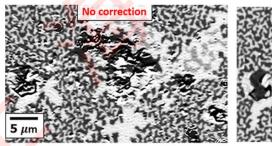
起的克尔旋转量与光源波长数量成反比,宽谱光源会产生相同宽谱的线偏振,也就是说,光偏振不是完美的线性,观察到的磁对比度也会降低。

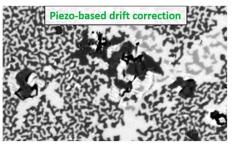


因此为了克服由于光源带来的相差, 我们经过多组测试, 最后选取了 FWHM 为 50nm 的超亮 LED 光源, 可获得很强的对比度, 并且拥有较高的使用寿命。

2) 图像自动校正功能

通常为了获得较弱磁性材料的对比度,市面上磁畴观察设备通常会采用图像差分处理来获得较高对比度,即使用拍摄到的图像减去背底图片。该方法通常可以将信号增强 10 倍以上。但是由于在施加磁场的过程中样品的位置会发生偏移,



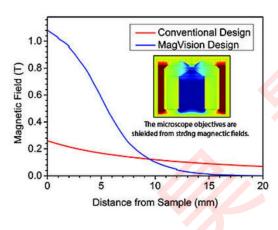


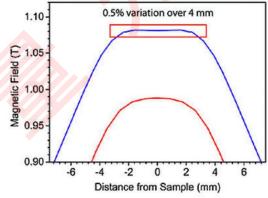
会大大影响差分处理效果,甚至出现错误。为了消除样品的移动,设备会通过快速像素相位算法确定样品漂移,然后通过压电促动器实时校正位置。同时该帧位移的图像在软件中也会实时修正,校正后的图像最大位移量小于0.2个像素(8nm)

3) 特殊设计的电磁铁

通常磁畴观察显微镜中的电磁铁设计是一个具有挑战性的话题,必须要有一些取舍。为了获得较高的分辨率,因此要使用大倍率的物镜,放置在靠近样品的位置。这对电磁铁强加以一个空间限制,并限制了生产磁场的强度。其次,磁铁产生的磁通量会通过物镜,引起法拉第效应,从而降低成像对比度。

我们通过革新的磁通量闭合式设计从而巧妙的解决了这两个问题。通过对电磁铁的磁场测量,我们可以发现,磁铁的最大磁场提高了 4 倍,但是通过物镜的磁场强度却降低了 8 倍。产生磁场的均匀性在 4mm 范围内也达到了 0.5%的一流水平。





4) 高灵敏度, 高分辨率成像相机

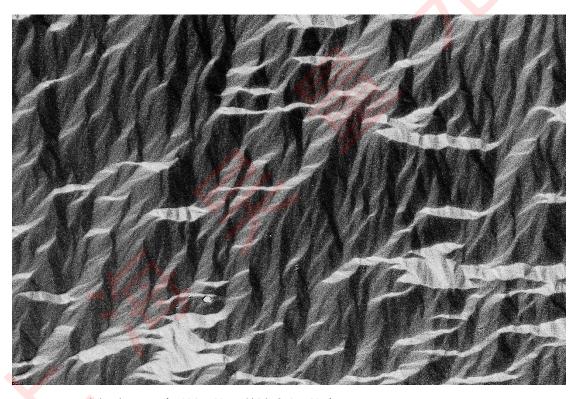
对于磁光克尔显微镜,样品反射的光通过检偏器,仅仅只有百分之一的入射光达到相机传感器。因此对于磁畴成像系统,相机的灵敏度就体现的尤为重要。因此为了达到最优的成像效果,我们选取了再该波段下量子效率高达 78%,并且具有 20 兆像素的背照式相机。从而获得高分辨率,高信噪比的图像。

产品参数:

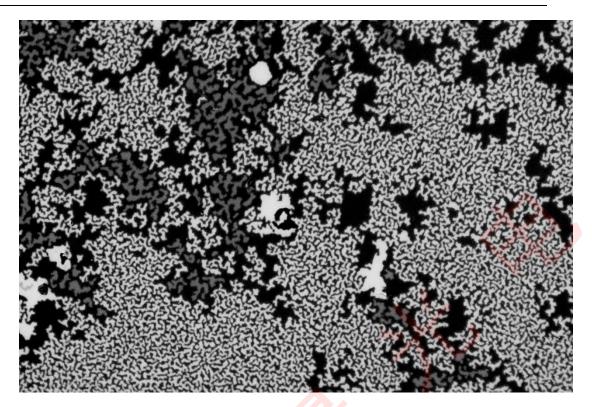
Light source	2200 Lumens ultrabright LED lamp
Camera	6.4 Megapixel @ 60FPS >78% Quantum efficiency
Resolution	300nm
Magnetic Field	1T(Perpendicular)/0.5T(Longitudina)
Power	230VAC ± 10%, 13Amp Single Phase
Requirement	
Size / Weight	Main System: 60 x 50 x 60cm, 25kg
	Power Supply Tower: 60 x 60 x 30cm, 10kg

实例:

1)1nm CoFeB 磁性薄膜



2) 4 种灰度: 垂直磁化磁隧道结多级磁畴 (4 shades of grey: Multilevel stripe domains on a perpendicularly magnetized magnetic tunnel junction stack)



3) [Pt/Co/Fe/Ir]x2 堆栈手性磁畴 (Chiral stripes (and skyrmions)on a [Pt/Co/Fe/Ir]x2 stack)

